

## Episil、アナログおよびパワー半導体デバイスの開発に Berkeley Design Automation の AFS Nano を選択

アナログ回路に対しナノメータ SPICE 精度と 10 倍以上の価格性能比を提供

2012 年 11 月 6 日、カリフォルニア州サンタクララ発 – 世界最高速のナノメータ回路検証ツールを提供する Berkeley Design Automation Inc. は本日、パワーおよびアナログ半導体製品向けエピタキシャルおよびシリコンウエハファウンドリ専門の Episil Technology, Inc. が、アナログおよびパワーデバイスのキャラクタライゼーションに AFS Nano SPICE シミュレータを選択したことを発表しました。

「必要な精度とパフォーマンスを備えた、コスト効果の高い回路シミュレータを所有することは、競争力あるキャラクタライズ戦略を実現する上できわめて重要な要素です。」 Episil の R&D & オペレーションサポートセンター、技術開発部、CAD 開発マネージャの Phoenix Deng 氏はこのように語っています。「AFS Nano は当社のアナログおよびパワーデバイスに対し、ナノメータ SPICE 精度のブロックレベルシミュレーションと 10 倍以上の価格性能比をもたらしてくれます。これは従来の SPICE ツールと比較しても説得力のある結果です。」

Analog FastSPICE Platform はナノメータ アナログ、RF、ミックスシグナル、カスタムデジタル回路設計のための世界最高速の回路検証プラットフォームです。20nm までファウンドリ認証を受けた AFS Platform はナノメータ SPICE 精度を他のシミュレータと比較してシングルコアで 5 倍~10 倍、マルチコアでは更にその 2 倍以上高速に達成します。回路キャラクタライゼーションに関しては、AFS Platform は業界唯一の包括的なシリコン精度のデバイスノイズ解析機能を有しており、コア数に応じて線形に近いパフォーマンスの高速化を達成できます。大規模回路に対しても 1000 万素子を超えるキャパシティを提供し、最も高速な SPICE 精度に近いシミュレーション、最も精度の高いミックスシグナルシミュレーションを実現しています。AFS Platform は、AFS 回路シミュレーション、AFS Transient Noise Analysis、AFS RF Analysis、AFS Co-Simulation、AFS Nano SPICE のライセンスで構成されています。

「Episil Technology が彼らのアナログおよびパワーデバイスの検証に AFS Nano を選択していただいたことを嬉しく思います。」 Berkeley Design Automation の社長兼 CEO、Ravi Subramanian はこのように語っています。「Episil が AFS Nano を選択されたことは、Analog FastSPICE Platform が半導体

エコシステムにもたらすことのできる強力な競争優位性および価格性能比のメリットを実証するものです。」

### **Berkeley Design Automation** について

Berkeley Design Automation Inc. はナノメータ回路検証をリードする企業として知られています。同社は世界最高速のナノメータ回路検証プラットフォーム、Analog FastSPICE と傑出したアプリケーション専門知識によりナノメータ回路設計課題を解決します。100社を超える企業が Berkeley Design Automation の製品を使ってナノメータ スケールの回路を検証しています。Berkeley Design Automation は業界での数々の賞を受賞し、その技術的リーダーシップとエレクトロニクス産業への貢献で広く認知されています。同社は Woodside Fund、Bessemer Venture Partners、パナソニック株式会社、NTT ファイナンス社、株式会社アイティーファーム、三菱 UFJ キャピタル株式会社が出資している未公開の企業です。詳しい情報は [www.berkeley-da.com](http://www.berkeley-da.com) をご覧ください。

Analog FastSPICE、AFS Nano、WaveCraveはBerkeley Design Automation, Inc. の商標です。Berkeley DesignならびにBDAはBerkeley Design Automation, Inc.の登録商標です。